



VIEW Micro-Metrology 公司简介



View Micro-Metrology 是高产量光学坐标测量仪器的领导者，广泛应用于数据存贮，电子，医药以及精密制造行业。

我们的快速测量系统，精密光学和软件可以为生产线以及进行普遍测量的计量室提供测量解决方案。

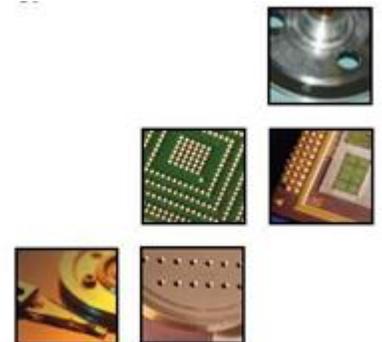
View Micro-Metrology 以速度和精度定义生产力。高精度和高速度的独特组合，非常适用于那些需要检测上千个关键尺寸的电子组件和其他零件。View Micro-Metrology 可以测量小至几个微米，大到一米的特征尺寸。

View Micro-Metrology 是一个数据驱动的世界，这样比直接给出结果更容易做出承诺，我们以数据形式备份支持我们的客户需求，来最小化客户的风险。通过综合应用研究以及基于性能的设备认可，使我们的设备性能得到保证。

我们的创新和品质的历史可以追溯到 1976 年，当时 View Micro-Metrology 引进了世界第一台三坐标自动可视测量系统，至今为止，成千上万的 View Micro-Metrology 可视系统正被应用于制造行业。

在 2000 年，View Micro-Metrology 加入了 Quality Vision International (QVI) 大家庭，一家拥有 60 年计量经验传承的全球化组织。QVI 总部位于纽约州罗契斯特市，在美国五个城市和法兰克福，新加坡以及上海设有分公司。QVI 公司已经在世界范围内 63 个国家成功安装了超过一万台尺寸测量系统。

View Micro-Metrology 通过结合世界一流的图像，视频测量技术，可靠精确的平台以及最出色的软件，从而拥有高效的产出以及低端的购置价格。下面让我们同 View Micro-Metrology 一起展示我们的优越性能。



30 年 创 新 制 造 经 验



RB-1

1200

1220

Voyager

Pinnacle

Summit

Benchmark

MicroLine

Precis

1976

2009



MicroLine 是一款高性能关键尺寸测量系统，应用于晶圆，掩模板，MEMS 和其他微细加工的设备，MicroLine 结合高达 100 倍的全功能显微镜进行测量，以及可选配的透射光照明和自动平台。



View Micro-metrology Benchmark 250 是一款紧凑通用型全功能计量系统，拥有其他大型号设备一样的性能，工作行程为 300X150X150 毫米，Benchmark 250 可以容纳大范围的零件尺寸，无论是 QA 实验室，亦或是生产车间的检测，它都能应用自如。



View Pinnacle 250 有着非凡的精度和测量速度，其超高的性能和紧凑的结构使其成为 View Micro-metrology 最流行的一款型号，Pinnacle 250 是测量小而精密公差零件的理想工具，如硬盘驱动悬框，打印机针头，引线框，球栅阵列以及芯片级封装。



View Micro-Metrology 系列测量行程大，精度高，是测量要求高精确度的大零件的理想工具，如焊料模板和屏幕，PCB 板，环形电路板，柔性电路以及微蚀刻零件。



Precis 200 光学关键尺寸测量系统，主要应用于微器件，晶圆，掩模板，MEMS 和 HDD 针头。Precis 结合精密平台，光学显微镜以及 3 个世界一流的软件包，使其拥有全新的更高级的性能。Precis 在测量晶圆，掩模板和微结构上能提供亚微米视场以及点对点的测量精度。



www.viewmm.com
Email: info@viewmm.com



中国区域总代理: 东莞市天测光学设备有限公司

地址: 广东省东莞市南城区周溪彭洞工业区 B 栋一楼 2 号

电话: 0769-33215215/13603074946 传真: 0769-89026366。

电子邮箱: info@tiance-optical.com 网址: www.tiance-optical.com

